

Thema

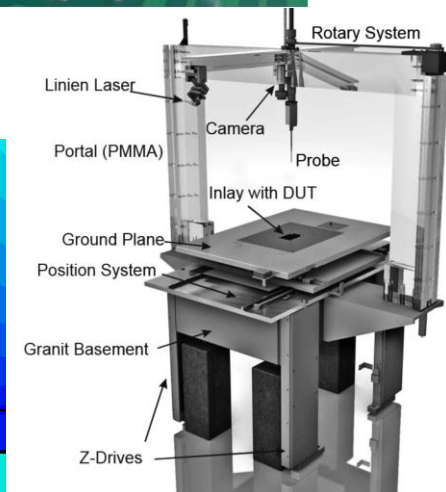
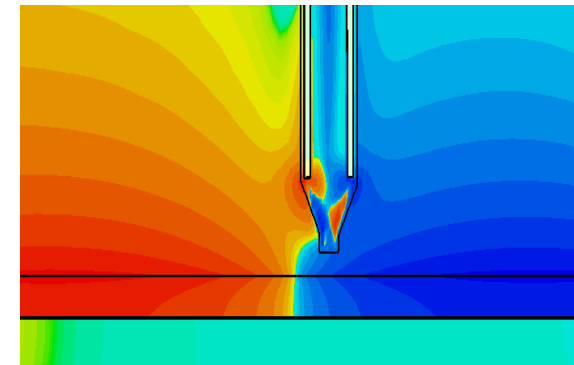
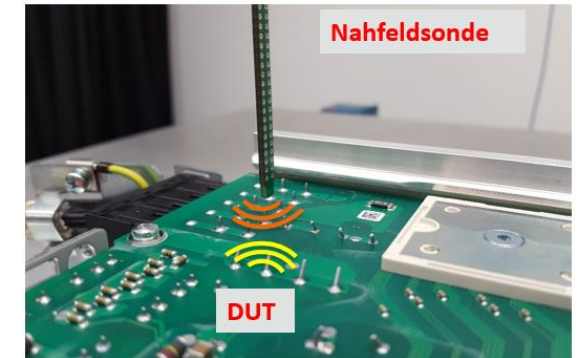
Untersuchung des Einflusses von Nahfeldsonden auf die Nahfelder und das Testobjekt in Frequenzbereichen bis 6 GHz

Fragestellung

Wie ändert sich das Nahfeld durch die Nahfeldsonde? Wie ändert sich das DUT?
In welchen Frequenzbereichen ist das Verhalten kritisch oder unbedenklich?
Gibt es mögliche Verbesserungsvorschläge?
Gibt es eine Abhängigkeit vom Abstand oder weiteren Parametern?

Aufgaben

- Einarbeiten in CST und Nahfeldsonden-Grundlagen
- Auswahl geeigneter Teststrukturen und Frequenzbereiche
- Modellierung einer einfachen Nahfeldsonde
- Simulation der verschiedenen Szenarien und Tests
 - Auswahl geeigneter Solver und Simulationsverfahren
- Evaluierung anhand der Nahfelddaten und S-Parameter
- Bericht und Vortrag der Ergebnisse



Ansprechpartner

Dominik Schröder
Fraunhofer ENAS
Abteilung: Advanced System Engineering
Mail: dominik.schroeder@enas-pb.fraunhofer.de

Dr.-Ing. Denis Sievers
Universität Paderborn
Fachgebiet TET
05251 / 60-3010
sievers@tet.upb.de